

การศึกษาเทคนิคการพ่นอนุภาคเพื่อการประยุกต์ใช้ใน Microfluidic

Study of Powder blasting technique for Microfluidic Application

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ วิศิษฐ์สรอรรถ และ ดร.อดิสร เตื่อนตรานนท์

ห้องปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



# Outline

- บทนำ

- หลักการพื้นฐานของเทคนิค การพ่นอนุภาค

- ขั้นตอนการทดลอง

- ผลการทดลอง

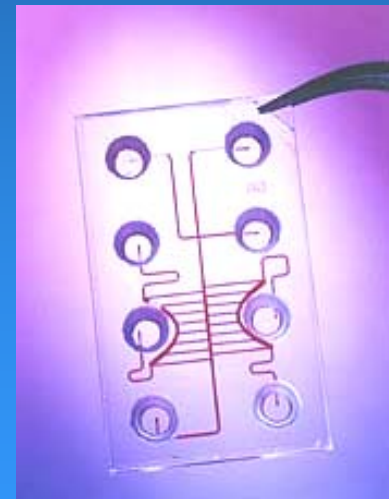
- สรุปผลการทดลอง

# Microfluidic

Microfluidics is the handling and dealing with small quantities (e.g. microlitres, nanolitres or even picolitres) of fluids (liquids or gases).



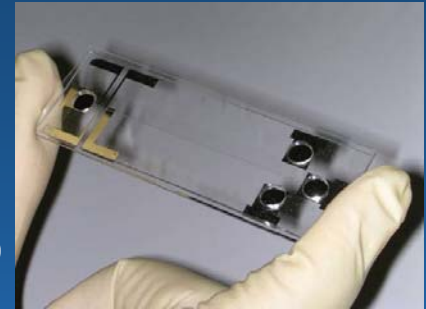
*Micronit*



*Agilent Technology*

# Lab on a chip

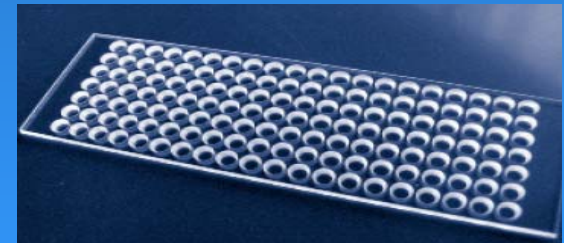
- Capillary Electrophoresis Chip



- Micro chemical reactor chips

- Microtiterplates

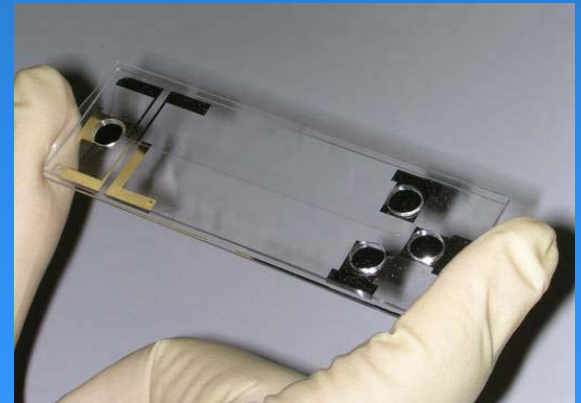
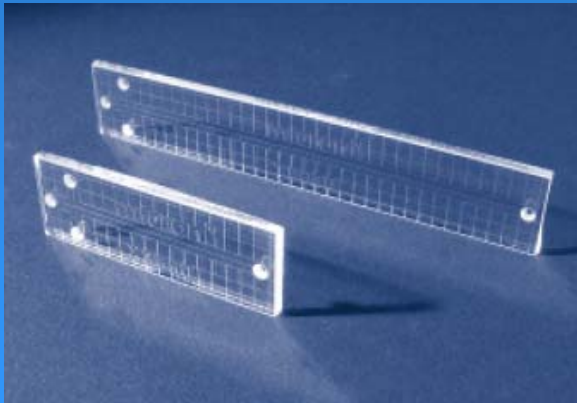
- PCR Chip



*Micronit*

# Lab on a chip

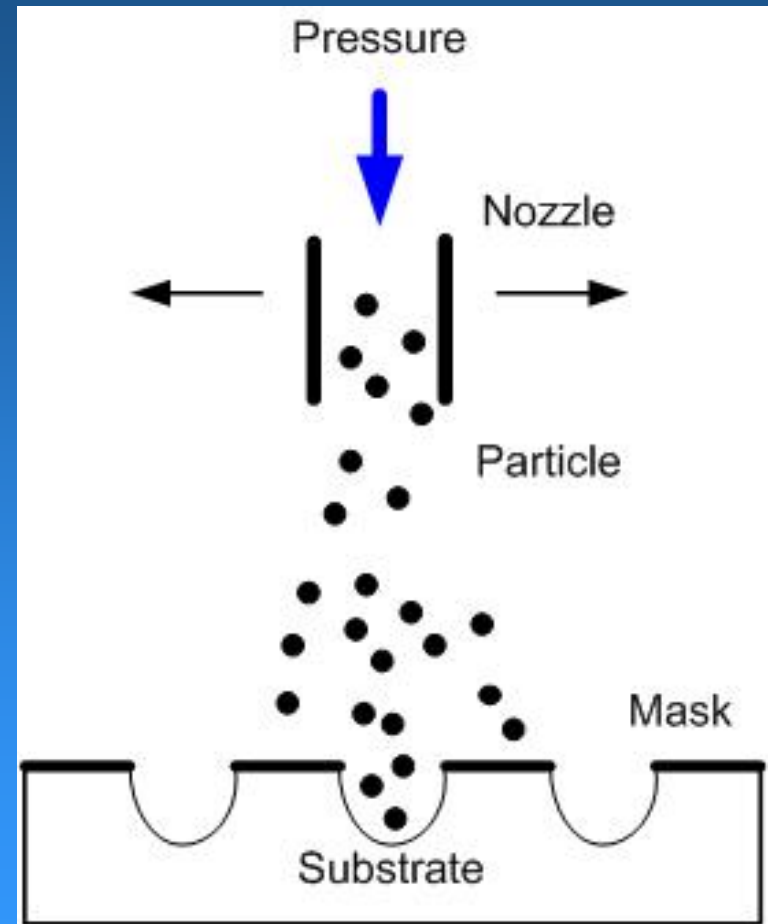
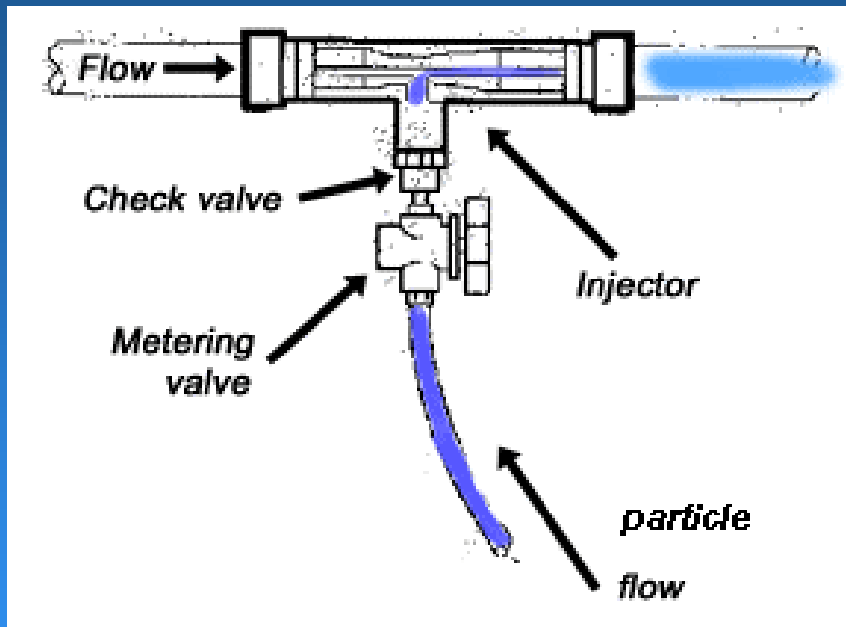
- Based on glass (Glass chip)
- Based on Si
- Based on Polymer (PDMS)



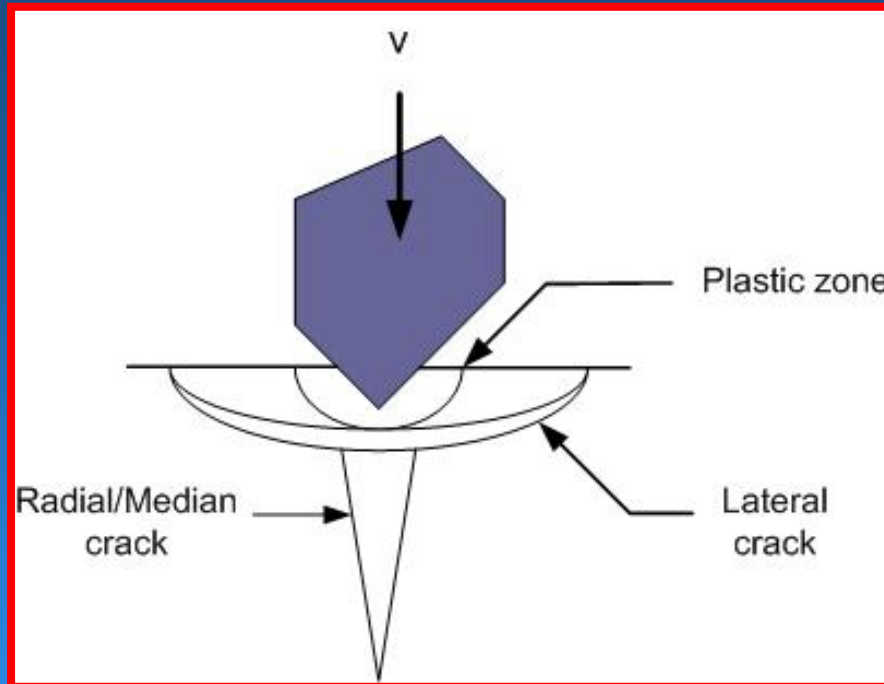
<b>Method</b>	<b>Minimum feature</b>	<b>Maximum depth</b>	<b>Aspect ratio</b>	<b>Design by mask</b>
<b>Drilling</b>	800 $\mu$ m	>1mm	10	No
<b>Milling</b>	500 $\mu$ m	>1mm	10	No
<b>Laser</b>	100 $\mu$ m	>1mm	25	No
<b>Ultrasonic drilling</b>	75 $\mu$ m	>1mm	10	No
<b>Electrochemical discharge drilling</b>	50 $\mu$ m	>1mm	15	Yes
<b>Photosensitive glass</b>	50 $\mu$ m	>1mm	20	Yes
<b>Powder blasting</b>	<50 $\mu$ m	>1mm	2.5	Yes
<b>HF etching</b>	1 $\mu$ m	>1mm	1	Yes
<b>RIE etching</b>	0.5 $\mu$ m	>1mm	5	Yes

Henk Wensink et.al

# หลักการพื้นฐานของเทคนิค การพ่นอนุภาค



# หลักการพื้นฐานของเทคนิค การพ่นอนุภาค



*P.J.Slikkerveer et.al*

กระบวนการในการเกิด การแตกร้าวในระดับไมโครเมตร (Micro crack)

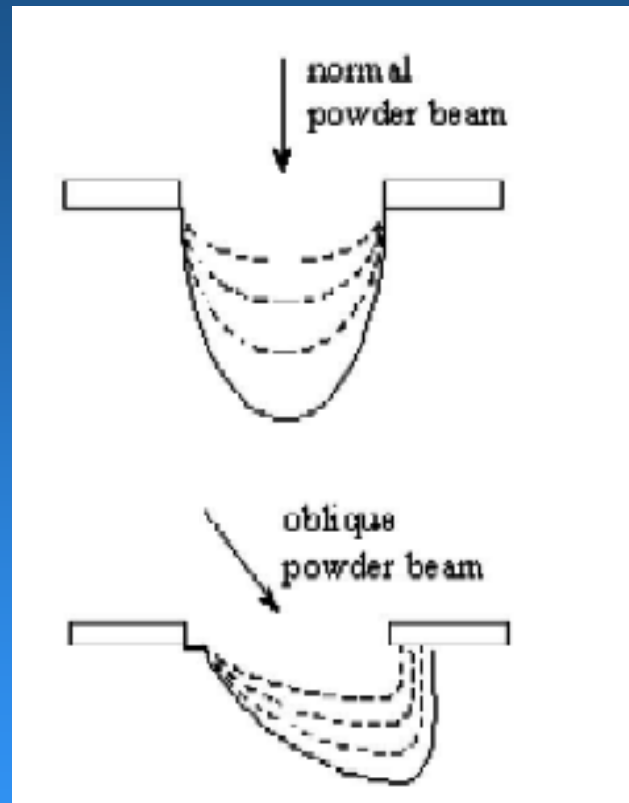
$$\text{Erosion efficiency} = \frac{\text{Amount of substrate material remove}}{\text{Amount of energy in particles used}} \times 100$$



## ปัจจัยที่มีผลต่อระบบเทคนิคการพ่นอนุภาค

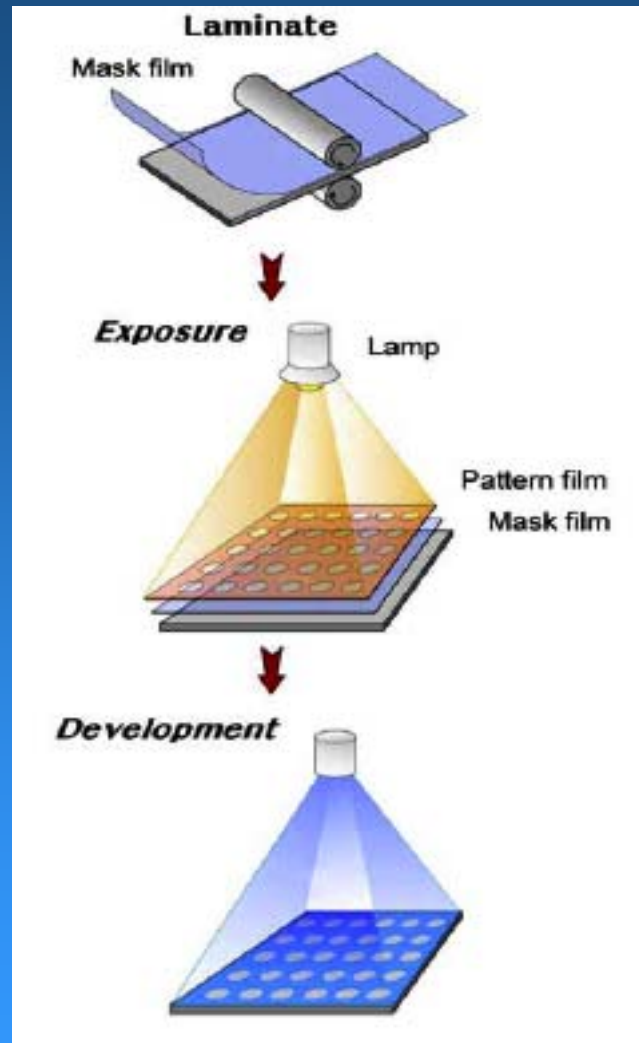
- ความดันในการพ่นและเวลาที่ใช้ในการพ่นอนุภาค
- มุมที่อนุภาคตกกระทบ
- วัสดุที่ใช้เป็นหน้ากาก
- คุณสมบัติของอนุภาคที่ใช้ในการพ่น

# ปัจจัยที่มีผลต่อระบบเทคนิคการพ่นอนุภาค

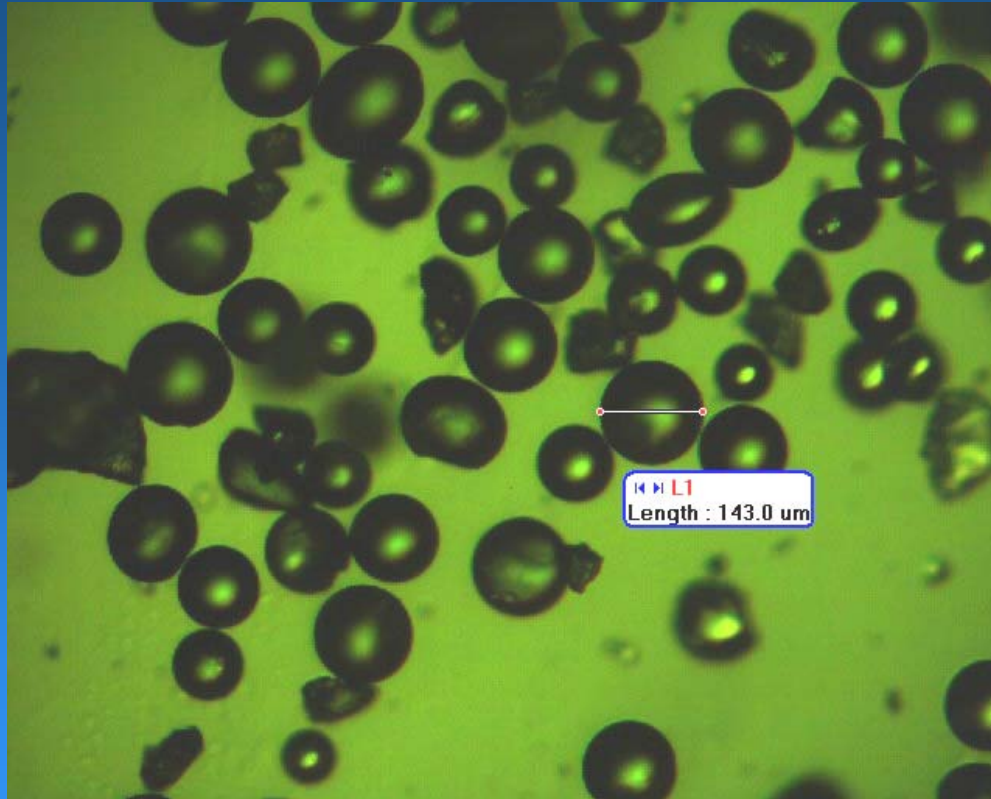


*A .-G . Pawlowski et al .*

# การสร้างหน้ากาก



# การพ่นอนุภาคด้วยเทคนิค การพ่นอนุภาค



ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดแก้ว (Glass bead)

## พารามิเตอร์ของเทคนิคการพ่นอนุภาคในการทดลอง

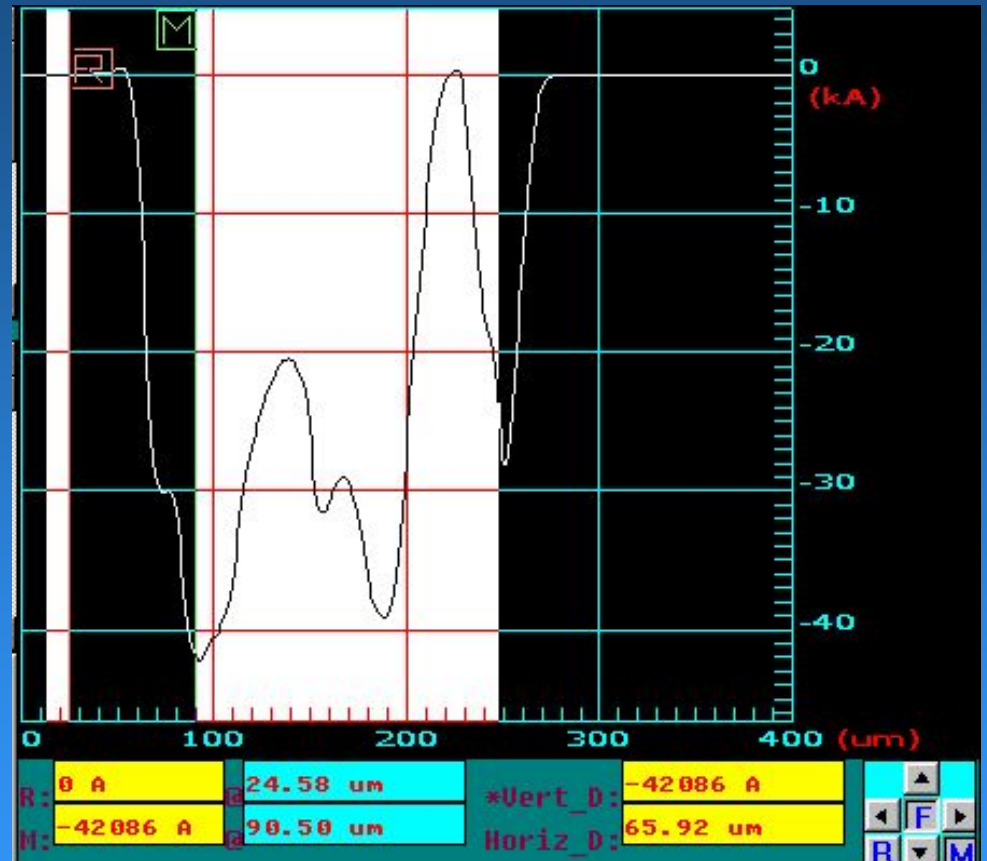
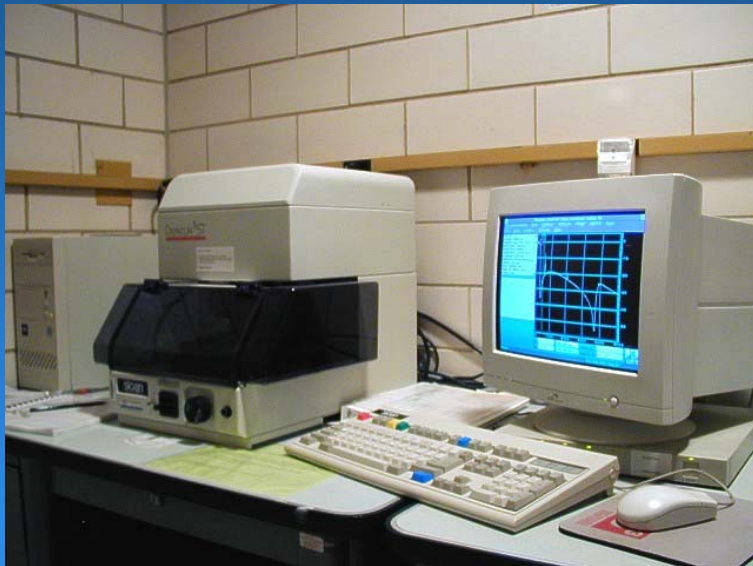
<i>Air Pressure</i>	<b>4-7 bars</b>
<i>Time</i>	<b>2 min</b>
<i>Particle size</i>	<b>Glass bead 140 <math>\mu\text{m}</math></b>
<i>Distance</i>	<b>50 mm</b>
<i>Nozzle diameter</i>	<b>6 mm</b>

# การวัดรูปร่างชิ้นงาน

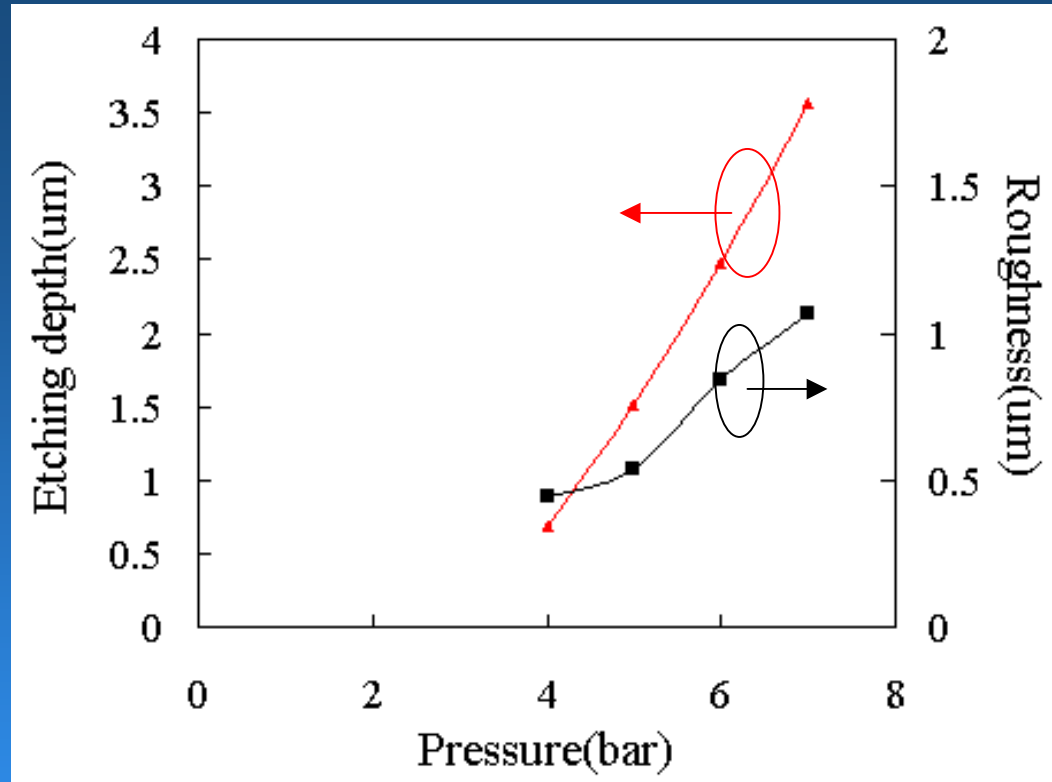


ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของชิ้นงานก่อน และหลังจากการพ่นอนุภาค

# ผลการวัดรูปร่างของร่องโดย Dektak Surface Profiler

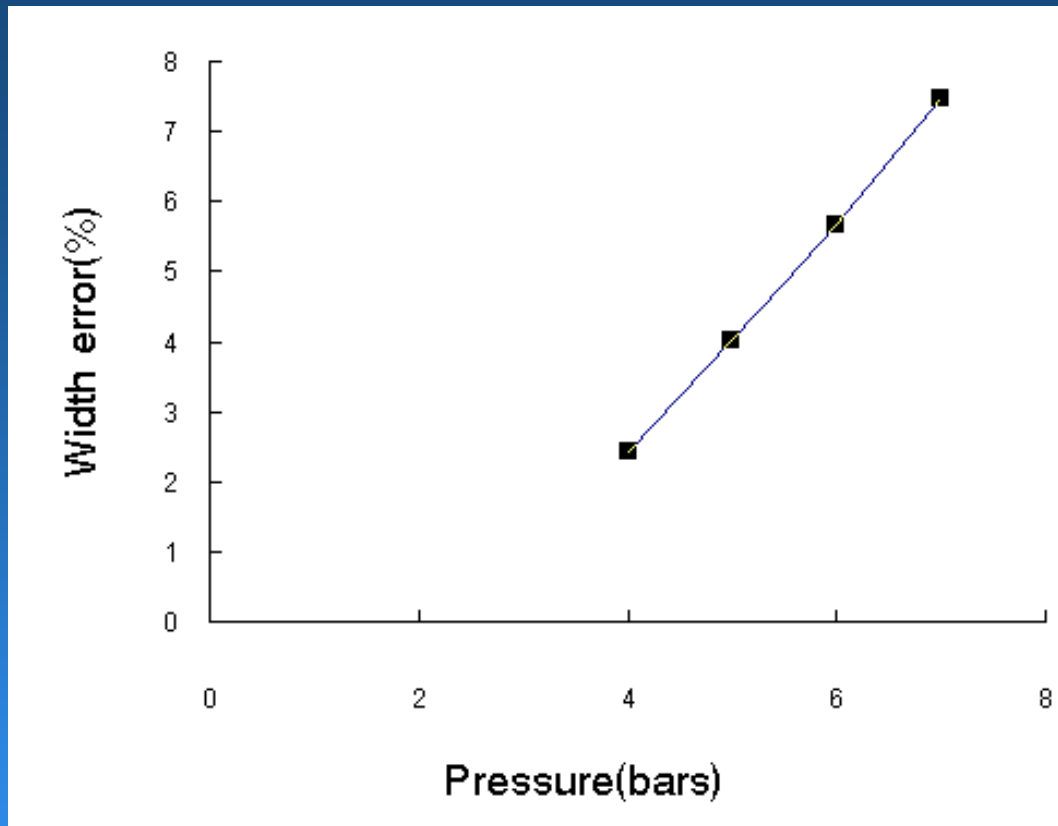


ผลการทดลองจากการวัดรูปแบบของร่องที่ถูกกัดเซาะที่ความดันการพ่น 6 bars



ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระ ความลึก  
ของชิ้นงานที่ถูกกัดเซาะและความดันในการพ่น





ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของความกว้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกัดเซาะของอนุภาคที่ความดันในการพ่นค่าต่างๆ

## สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าเมื่อทำการพ่นอนุภาคลงบนแก้ว โดยความกว้างของร่องมีค่าประมาณ 270 ไมโครเมตร และใช้วัสดุที่เป็นหน้าฉากคือ ฟิล์มไวแสง พบว่าฟิล์มไวแสงจะถูกกัดกร่อนทำให้ชิ้นงานที่ได้มีค่าความกว้างของร่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าความลึกของการกัดเซาะจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในการพ่นมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกับค่าความขรุขระของผิวหน้าชิ้นงานที่มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าเมื่ออนุภาคมีค่าพลังงานสูงขึ้น จะทำให้ชิ้นงานถูกกัดเซาะมากขึ้นเนื่องจากเกิดการแตกร้าวในเนื้อวัสดุชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น

## การศึกษาและทดลองขั้นต่อไป

1. วัสดุที่เหมาะสมในการใช้เป็นหน้ากากโดยจะต้องมีความทนทานต่อการกัดเซาะของอนุภาค และสามารถสร้างรูปแบบขนาดเล็กในระดับไมโครเมตรได้
2. ใช้อนุภาคที่มีขนาดที่เหมาะสมในการพ่นเพื่อสร้างรูปแบบของร่อง ซึ่งควรจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า  $30 \mu\text{m}$
3. สร้างระบบการเลื่อนชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานได้ถูกกัดเซาะจากการพ่นอนุภาคอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

## กิตติกรรมประกาศ

- ขอขอบคุณ คุณวิยพล พัฒนเศรษฐกุล ห้องปฏิบัติการฟิล์มบาง ฝ่ายวิจัย RDE3 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำหรับเครื่องพ่นอนุภาค และคำแนะนำในการทำงานวิจัย
- ขอขอบคุณ ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับเครื่องวัด Dektak Surface Profiler

# ขอขอบคุณครับ

